



114 年度工研院技術移轉與法律中心

網路、通訊、雲端等相關研發成果非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。
- 二、非專屬授權標的：本案授權標的包含研發成果 64 案 127 件，詳如附件。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - （一）舉辦時間：民國（下同）114 年 7 月 4 日下午 2 時至下午 3 時。
 - （二）舉辦地點：以線上會議方式舉辦。
 - （三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 114 年 7 月 3 日中午 12 時整(含)前以電子郵件向本案聯絡人報名(主旨請註明「114 年度工研院技術移轉與法律中心網路、通訊、雲端等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱)。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 114 年 7 月 3 日下午 5 時整(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- 五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 黃小姐
電話：03-5913935
傳真：03-5820466
電子信箱：ycmhuang@itri.org.tw
地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：專利授權標的

(一) 人工智慧 (6 案 11 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
1	1	P51120063US	用於稀疏注意力 運算的演算法	美國	審查中	18/951,676			經濟部 產業技術司
2	2	P51130027US	基於注意力分數的 注意力機制調整 方法及使用所述 方法的計算裝置	美國	審查中	18/961,430			經濟部 產業技術司
3	3	P51130028CN	訓練方法、訓練樣本 的優化方法與電子 裝置	中國 大陸	審查中	202411497912.4			經濟部產業 技術司
	4	P51130028US	訓練方法、訓練樣本 的優化方法與電子 裝置	美國	審查中	18/937,051			經濟部產 業技術司
4	5	P51130032US	用於模型與可重組 硬體的裝置及方法	美國	審查中	18/951,659			經濟部 產業技術司
5	6	P52130029CN	用於剪枝模型的 裝置及方法	中國 大陸	審查中	202510061196.3			經濟部 產業技術司
	7	P52130029TW	用於剪枝模型的 裝置及方法	中華 民國	審查中	113144239			經濟部 產業技術司
	8	P52130029US	用於剪枝模型的 裝置及方法	美國	審查中	19/060,773			經濟部 產業技術司
6	9	P52130044CN	數據擴增方法及其 系統	中國 大陸	審查中	202411816396.7			經濟部 產業技術司
	10	P52130044TW	資料擴增方法及其 系統	中華 民國	審查中	113145410			經濟部 產業技術司
	11	P52130044US	資料擴增方法及其 系統	美國	審查中	18/991,680			經濟部 產業技術司

(二) 元宇宙 (3 案 4 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
7	12	P51090036CNC1	頭戴式眼球追蹤 系統	中國 大陸	審查中	202411904228.3			經濟部 產業技術司
	13	P51090036USC2	頭戴式眼動追蹤 系統	美國	審查中	18/940,860			經濟部 產業技術司



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
8	14	P51120033TW	觸覺渲染系統及觸覺渲染方法	中華民國	審查中	113128332			經濟部 產業技術司
9	15	P52130041US	應用於遊戲內容的動態視角畫面間預測視訊編碼方法	美國	審查中	18/983,414			經濟部 產業技術司

(三) 先進駕駛輔助系統 (4 案 8 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
10	16	P53130024TW	互動式車道變換控制系統、方法以及顯示介面	中華民國	審查中	113149076			經濟部 產業技術司
	17	P53130024US	互動式車道變換控制系統、方法以及顯示介面	美國	審查中	18/983,369			經濟部 產業技術司
11	18	P53130030JP	立體物件偵測方法與立體物件偵測系統	日本	審查中	2025-69543			經濟部 產業技術司
	19	P53130030TW	立體物件偵測方法與立體物件偵測系統	中華民國	審查中	113150958			經濟部 產業技術司
12	20	P53130031TW	高度資訊重建系統及高度資訊重建方法	中華民國	審查中	113147475			經濟部 產業技術司
	21	P53130031US	高度資訊重建系統及高度資訊重建方法	美國	審查中	18/970,936			經濟部 產業技術司
13	22	P53130032TW	車輛狀態預測系統及方法	中華民國	審查中	113148981			經濟部 產業技術司
	23	P53130032US	車輛狀態預測系統及方法	美國	審查中	18/982,876			經濟部 產業技術司

(四) 微處理器架構 (2 案 6 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
14	24	P51100006EP	高頻元件測試裝置及其測試方法	EPC/ 歐盟	審查中	EP25153018.4			經濟部 產業技術司
	25	P51100006JP	高頻元件測試裝置及其測試方法	日本	審查中	2024-225291			經濟部 產業技術司
	26	P51100006TWC1	高頻元件測試裝置及其測試方法	中華民國	審查中	114103792			經濟部 產業技術司



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
	27	P51100006USC1	高頻元件測試裝置及其測試方法	美國	審查中	18/921,460			經濟部 產業技術司
15	28	P51130044TW	資料處理裝置及資料處理方法	中華民國	審查中	113146610			經濟部 產業技術司
	29	P51130044US	資料處理裝置及資料處理方法	美國	審查中	19/001,358			經濟部 產業技術司

(五) 網路 (1 案 4 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
16	30	P52130028CN	行車資訊處理裝置及行車資料提供方法	中國大陸	審查中	202510033425.0			經濟部 產業技術司
	31	P52130028EP	行車資訊處理裝置及行車資料提供方法	EPC/ 歐盟	審查中	EP25159451.1			經濟部 產業技術司
	32	P52130028TW	行車資訊處理裝置及行車資料提供方法	中華民國	審查中	113147944			經濟部 產業技術司
	33	P52130028US	行車資訊處理裝置及行車資料提供方法	美國	審查中	19/047,642			經濟部 產業技術司

(六) 通訊 (6 案 11 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
17	34	P51130015CN	波束成型天線校準方法與波束成型天線校準系統	中國大陸	審查中	202411331132.2			經濟部 產業技術司
18	35	P52100044DE	路側設備訊息傳輸系統及其方法	德國	獲證	EP4187520	20250129	20411219	經濟部 產業技術司
	36	P52100044FR	路側設備訊息傳輸系統及其方法	法國	獲證	EP4187520	20250129	20411219	經濟部 產業技術司
	37	P52100044GB	路側設備訊息傳輸系統及其方法	英國	獲證	EP4187520	20250129	20411219	經濟部 產業技術司
19	38	P52130014EP	多重輸入多重輸出功率放大器全角度	EPC/ 歐盟	審查中	EP24210608.6			經濟部 產業技術司



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
			線性化預處理方法 及使用所述方法的多重輸入多重輸出 全角度線性化波束形成裝置						
20	39	P52130030EP	在衛星通訊中配置無線電資源的方法和無線通訊裝置	EPC/ 歐盟	審查中	EP25166606.1			經濟部 產業技術司
	40	P52130030TW	在衛星通訊中配置無線電資源的方法和無線通訊裝置	中華民國	審查中	113144255			經濟部 產業技術司
	41	P52130030US	在衛星通訊中配置無線電資源的方法和無線通訊裝置	美國	審查中	19/072,947			經濟部 產業技術司
21	42	P52130031TW	運算資源管理方法以及運算裝置	中華民國	審查中	113142802			經濟部 產業技術司
	43	P52130031US	運算資源管理方法以及運算裝置	美國	審查中	19/189,282			經濟部 產業技術司
22	44	P52130032TW	跨衛星網路的傳送裝置、方法及接收裝置、方法	中華民國	審查中	114103865			經濟部 產業技術司

(七) 雲端 (28 案 49 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
						審查中：申請號			
23	45	P07080004DE	被動式基材螢光薄膜厚度檢測裝置及方法	德國	獲證	EP3845893	20221221	20400426	經濟部 產業技術司
	46	P07080004NL	被動式基材螢光薄膜厚度檢測裝置及方法	荷蘭	獲證	EP3845893	20221221	20400426	經濟部 產業技術司
	47	P07080004SE	被動式基材螢光薄膜厚度檢測裝置及方法	瑞典	獲證	EP3845893	20221221	20400426	經濟部 產業技術司
24	48	P07110002US	β 2-微球蛋白濃度的分析方法及裝置	美國	審查中	18/096,447			工研院
25	49	P07110003CN	電池檢測方法及裝置	中國大陸	審查中	202310033772.4			經濟部 產業技術司



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
	50	P07110003US	電池檢測方法及裝置	美國	審查中	18/152,771			經濟部 產業技術司
26	51	P07110004TW	液體中非揮發性殘留物濃度量測系統及其方法	中華民國	獲證	TWI847749	20240701	20430606	工研院
27	52	P07110006US	兆赫波檢測晶片及兆赫波量測系統	美國	審查中	18/087,462			經濟部 產業技術司
28	53	P07110009TW	奈米結構參數決定方法方法和裝置	中華民國	獲證	TWI869865	20250111	20430528	經濟部 產業技術司
	54	P07110009US	三維奈米結構缺陷診斷方法和裝置	美國	審查中	18/374,289			經濟部 產業技術司
29	55	P07110012US	量測系統及量測方法	美國	獲證	US12270638	20250408	20430810	經濟部 產業技術司
30	56	P07110014CN	樣本深度量測裝置與方法	中國大陸	審查中	202310397609.6			經濟部 產業技術司
	57	P07110014TW	樣本深度量測裝置與方法	中華民國	獲證	TWI872497	20250211	20430328	經濟部 產業技術司
	58	P07110014US	樣本深度量測裝置與方法	美國	審查中	18/308,223			經濟部 產業技術司
31	59	P07120001TW	β 2-微球蛋白濃度的分析方法及系統	中華民國	獲證	TWI852456	20240811	20430330	工研院
	60	P07120001US	β 2-微球蛋白濃度的分析方法及系統	美國	審查中	18/132,341			工研院
32	61	P07120002TW	非揮發性殘留物量測系統及方法	中華民國	審查中	112136995			經濟部 產業技術司
33	62	P07120004TW	溫室氣體排放量化的數位查證系統及方法	中華民國	獲證	TWI871100	20250121	20431120	經濟部 產業技術司
34	63	P07120007TW	微細通孔量測設備	中華民國	獲證	TWI879300	20250401	20431210	經濟部 產業技術司
35	64	P07120008TW	光譜特徵量測方法	中華民國	審查中	113147564			工研院
	65	P07120008US	光譜特徵量測方法	美國	審查中	18/985,050			工研院
36	66	P07130001TW	用於分析三維奈米結構的 X 射線設備及分析三維奈米結構的方法	中華民國	審查中	113115827			經濟部 產業技術司
	67	P07130001US	用於分析三維奈米結構的 X 射線設備	美國	審查中	18/647,476			經濟部 產業技術司



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
			及分析三維奈米結構的方法						
37	68	P07130002TW	基於散射的 X 光量測結構疊對的方法及系統	中華民國	獲證	TWI878106	20250321	20440429	經濟部 產業技術司
	69	P07130002US	基於散射的 X 光量測結構疊對的方法及系統	美國	審查中	18/651,559			經濟部 產業技術司
38	70	P07130003TW	狹縫調整型被動式基材螢光薄膜厚度量測裝置及應用其之量測方法	中華民國	審查中	113115976			經濟部 產業技術司
39	71	P07130004TW	檢測系統及其檢測方法	中華民國	審查中	113138508			經濟部 產業技術司
	72	P07130004US	檢測系統及其檢測方法	美國	審查中	19/015,452			經濟部 產業技術司
0	73	P07130005TW	流體檢測系統及方法	中華民國	審查中	113139342			經濟部 產業技術司
	74	P07130005US	流體檢測系統及方法	美國	審查中	18/986,533			經濟部 產業技術司
41	75	P07130006TW	三維形貌檢測裝置與量測高深寬比微結構深度的量測方法	中華民國	審查中	113148696			經濟部 產業技術司
	76	P07130006US	三維形貌檢測裝置及其量測高深寬比微結構深度的量測方法	美國	審查中	19/000,060			經濟部 產業技術司
42	77	P07130008TW	燃燒器裝置	中華民國	審查中	113149143			經濟部 產業技術司
43	78	P07130009TW	光成份檢測器及方法	中華民國	審查中	113147912			經濟部 產業技術司
	79	P07130009US	光成份檢測器及方法	美國	審查中	19/001,869			經濟部 產業技術司
44	80	P07130010TW	力量感測模組及應用其之可撓管裝置	中華民國	審查中	113149655			經濟部 產業技術司
45	81	P07130012TW	橢偏儀及其操作方法	中華民國	審查中	113150003			經濟部 產業技術司

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
46	82	P07130013TW	光源焦點位置量測系統和量測光源焦點位置的方法	中華民國	審查中	113150814			經濟部 產業技術司
	83	P07130013US	光源焦點位置量測系統和量測光源焦點位置的方法	美國	審查中	19/002,516			經濟部 產業技術司
47	84	P69120008US	電池組偵測系統及電池組模組的偵測方法	美國	審查中	18/974,566			經濟部 產業技術司
48	85	P69130004CN	水質檢測設備及應用其之水質檢測方法	中國大陸	審查中	202411916045.3			經濟部 產業技術司
	86	P69130004TW	水質檢測設備及應用其之水質檢測方法	中華民國	審查中	113144627			經濟部 產業技術司
	87	P69130004US	水質檢測設備及應用其之水質檢測方法	美國	審查中	19/001,899			經濟部 產業技術司
49	88	P69130012CN	安全事件判斷系統及其方法	中國大陸	審查中	202510129701.3			經濟部 產業技術司
	89	P69130012TW	安全事件判斷系統及其方法	中華民國	審查中	113149663			經濟部 產業技術司
	90	P69130012US	安全事件判斷系統及其方法	美國	審查中	19/176,584			經濟部 產業技術司
50	91	P69130013CN	超穎透鏡奈米柱的排列方法	中國大陸	審查中	202411868891.2			經濟部 產業技術司
	92	P69130013TW	超穎透鏡奈米柱的排列方法	中華民國	審查中	113145388			經濟部 產業技術司
	93	P69130013US	超穎透鏡奈米柱的排列方法	美國	審查中	19/001,394			經濟部 產業技術司



(八) 非嵌入式 記憶體系統架構設計 (1 案 3 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
51	94	P51100036JP	半導體結構及其製造方法	日本	審查中	2024-203567			經濟部 產業技術司
	95	P51100036TWC1	半導體結構及其製造方法	中華民國	審查中	113143414			經濟部 產業技術司
	96	P51100036USC1	半導體結構及其製造方法	美國	審查中	18/940,769			經濟部 產業技術司

(九) 面板顯示技術 (12 案 29 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
52	97	P51120024CN	光場顯示模組	中國大陸	審查中	202410892292.8			經濟部 產業技術司
53	98	P51120077CN	透明投影膜結構	中國大陸	審查中	202510182434.6			經濟部 產業技術司
	99	P51120077TW	透明投影膜結構	中華民國	審查中	113151050			經濟部 產業技術司
	100	P51120077US	透明投影膜結構	美國	審查中	19/072,826			經濟部 產業技術司
54	101	P51130039TW	曲面立體顯示器與其製作方法	中華民國	審查中	113150394			經濟部 產業技術司
	102	P51130039US	曲面立體顯示器與其製作方法	美國	審查中	19/079,488			經濟部 產業技術司
55	103	P51130045TW	背光板	中華民國	審查中	113151602			經濟部 產業技術司
	104	P51130045US	背光板	美國	審查中	19/005,640			經濟部 產業技術司
56	105	P54090045CN	聚合物、包含其之組合物、以及聚矽氧烷-聚醯亞材料	中國大陸	獲證	CN114685790	20240917	20410525	經濟部 產業技術司
	106	P54090045TW	聚合物、包含其之組合物、以及聚矽氧烷-聚醯亞材料	中華民國	獲證	TWI776342	20220901	20401230	經濟部 產業技術司
	107	P54090045US	聚合物、包含其之組合物、以及聚矽氧烷-聚醯亞材料	美國	獲證	US11667757	20230606	20410804	經濟部 產業技術司



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
57	108	P54110005JP	感光組合物及其所 形成之薄膜	日本	獲證	JP7456038	20240315	20430322	經濟部 產業技術司
	109	P54110005US	感光組合物及其所 形成之薄膜	美國	審查中	18/189,546			經濟部 產業技術司
58	110	P54110064TW	對陣列基板進行 選擇性蝕刻的方法	中華民國	獲證	TW1830562	20240121	20421228	經濟部 產業技術司
	111	P54110064US	對陣列基板進行 選擇性蝕刻的方法	美國	審查中	18/090,505			經濟部 產業技術司
59	112	P54120007CN	聚合物、正型光阻 組合物、與形成圖案 化光阻層的方法	中國大陸	審查中	202410884863.3			經濟部 產業技術司
	113	P54120007JP	聚合物、正型光阻 組合物、與形成圖案 化光阻層的方法	日本	審查中	2024-191677			經濟部 產業技術司
	114	P54120007TW	聚合物、正型光阻 組合物、與形成圖案 化光阻層的方法	中華民國	審查中	113106345			經濟部 產業技術司
	115	P54120007US	聚合物、正型光阻 組合物、與形成圖案 化光阻層的方法	美國	審查中	18/895,882			經濟部 產業技術司
60	116	P54120016CN	組合物及封裝結構	中國大陸	審查中	202411548875.5			經濟部 產業技術司
	117	P54120016TW	組合物及封裝結構	中華民國	審查中	113115760			經濟部 產業技術司
	118	P54120016US	組合物及封裝結構	美國	審查中	19/019,835			經濟部 產業技術司
61	119	P54120025CN	電子裝置及其製造 方法	中國大陸	審查中	202311739696.5			經濟部 產業技術司
	120	P54120025TW	電子裝置及其製造 方法	中華民國	審查中	112145962			經濟部 產業技術司
62	121	P54130044CN	間隙材凸塊的形成 方法	中國大陸	審查中	202411786857.0			經濟部 產業技術司
	122	P54130044TW	間隙材凸塊的形成 方法	中華民國	審查中	114100729			經濟部 產業技術司
	123	P54130044US	間隙材凸塊的形成 方法	美國	審查中	19/016,996			經濟部 產業技術司
63	124	P54130066TW	聚合物、正型光阻 組合物、與形成圖案 化光阻層的方法	中華民國	審查中	113151481			經濟部 產業技術司



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
	125	P54130066US	聚合物、正型光阻 組合物、與形成圖案 化光阻層的方法	美國	審查中	19/004,749			經濟部 產業技術司

(十) 其他 (1 案 2 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	獲證：公告號	專利起期	專利迄期	委辦 單位
						審查中：申請號			
64	126	P54130018TW	拉引機及其使用 方法	中華民國	審查中	113142129			經濟部 產業技術司
	127	P54130018TWA1	拉引機	中華民國	獲證	TWM665651	20250111	20341103	經濟部 產業技術司

【備註】本案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。